

Продолжение примерного учебного плана по специальности 6-05-0716-08 "Микро- и наносистемная техника", регистрационный № _____

БПК-3	Владеть основными понятиями и законами физики, принципами экспериментального и теоретического изучения физических явлений и процессов, применять полученные знания для решения задач теоретической и практической направленности	1.3.1
БПК-4	Владеть основными понятиями и законами химии, принципами экспериментального и теоретического изучения химических явлений и процессов, уметь применять полученные знания для решения задач теоретической и практической направленности	1.3.2
БПК-5	Знать структуру и свойства, физико-химические основы синтеза современных технических материалов, прикладной аппарат для решения задач в области материаловедения	1.5.1
БПК-6	Знать основные типы материалов для производства изделий электроники, владеть информацией об особенностях их свойств, уметь рационально применять эту информацию при проектировании изделий электроники, оценке их свойств и организации их производства	1.5.2
БПК-7	Знать механические, теплофизические, электрофизические, оптические и химические свойства материалов микро- и наносистемной техники, быть способным применять эти материалы с учетом особенностей функционирования и условий эксплуатации микро- и наносистемной техники	1.5.3
БПК-8	Владеть основными понятиями и законами физической химии, навыками экспериментального изучения физико-химических явлений и процессов, уметь использовать полученную информацию для решения производственных задач	1.5.4
БПК-9	Владеть общими закономерностями процессов, эффектов и явлений при производстве материалов и компонентов электронной техники, знать перспективные технологии изготовления материалов и компонентов электронной техники, уметь применять полученную информацию для решения технологических задач	1.6.1
БПК-10	Знать основы физики полупроводников и диэлектриков, уметь использовать физические модели для описания и анализа процессов, протекающих в твердых телах	1.7.1
БПК-11	Владеть основными понятиями и законами физики поверхности, знать основные методы исследования поверхности, уметь применять эти методы для получения технологической информации	1.7.2
БПК-12	Владеть основными законами физики и химии, определяющими принцип действия компонентов микро-и наносистемной техники, знать их конструкции и характеристики, быть способным применять методы определения изгибной жесткости мембранных компонентов, определять трибологические свойства поверхностей и формировать сенсорные слои методом Ленгмюра-Блоджетт	1.8.1
БПК-13	Владеть основными принципами функционирования физических и химических сенсоров и технологиями их изготовления, быть способным разрабатывать новые и эффективно применять существующие сенсорные системы	1.8.2
БПК-14	Владеть знаниями о фундаментальных физических закономерностях явлений в микро- и наноразмерных твердотельных структурах и их свойствах, знать конструкции и технологические методы создания микро- и наноразмерных структур, применять полученные знания при разработке и производстве микро- и нанoeлектронных компонентов	1.9.1
БПК-15	Владеть зондовыми нанотехнологиями, литографическими методами формирования поверхностных периодических и самоорганизованных структур и применять полученные знания для решения технологических задач	1.9.2
БПК-16	Владеть основными понятиями и законами физики и химии наноструктур, применять полученные знания для решения производственных задач	1.9.3
БПК-17	Уметь определять опасные производственные факторы и меры защиты от них в условиях конкретного производства	1.10.1, 1.10.2
БПК-18	Уметь проводить инструктаж работающих по охране труда и обучение их безопасным приемам работы	1.10.3
БПК-19	Владеть основными методами ресурсо-и энергосбережения, способностью оценивать экологические последствия реализации продукции и реализации производственных процессов	
СК-1	Уметь читать и выполнять машиностроительные чертежи с использованием стандартов и справочников	2.2.1
СК-2	Уметь использовать теоретические положения механики для анализа механических систем и конструкций	2.2.2
СК-3	Быть способным разрабатывать механизмы, несущие конструкции, корпуса и корпусные детали приборов и устройств	2.2.3
СК-4	Уметь применять основные понятия и методологические основы теоретической метрологии для решения производственных и технологических задач	2.2.4
СК-5	Быть способным решать задачи анализа и синтеза электрических цепей	2.3.1
СК-6	Уметь рассчитывать типовые схемы аналоговых и цифровых устройств	2.3.2
СК-7	Владеть информацией об основных радиоэлектронных схемах и применять полученные знания для разработки технологий производства изделий электроники	2.3.3
СК-8	Владеть информацией об основах конструирования электронных приборов, их эксплуатационных характеристиках, областях применения, уметь применять полученную информацию для решения производственных задач	2.3.4
СК-9	Знать устройство микроконтроллеров и микропроцессоров, основные алгоритмы их работы и программирования, уметь применять полученные знания для решения производственных задач	2.3.5
СК-10	Быть способным использовать экономические знания для принятия рациональных решений в профессиональной деятельности; уметь рассчитать цены на продукцию и оценивать экономические результаты деятельности предприятия	2.4.1
СК-11	Владеть теоретическими основами и экспериментальными методами микро- и наномеханики, методологией определения свойств структуры материалов в микро- и наномасштабе, быть способным применить методы сканирующей зондовой микроскопии для исследования поверхности и внутренней структуры неорганических и органических образцов	2.5.1
СК-12	Владеть практическими методами сканирующей зондовой микроскопии и основными принципами конструирования и использования приборов наноконтроля	2.5.2

Продолжение типового учебного плана по специальности 1-38 01 04 "Микро- и наносистемная техника", регистрационный № _____

СК-13	Владеть основными методами определения физико-химических свойств веществ и материалов, уметь применять полученную информацию для решения производственных задач	2.5.3
СК-14	Владеть основами информационных технологий, применяемых при конструировании и разработке технологий изготовления изделий микро- и наносистемной техники	2.5.4
СК-15	Знать основные положения теории надежности и методы планирования и проведения испытаний	2.5.5
СК-16	Владеть основными методами моделирования систем автоматического управления, рационально использовать полученные знания при проектировании микро- и нанозлектромеханических систем	2.6.1
СК-17	Владеть теоретическими знаниями о микросистемных устройствах и практическими навыками по эффективному их применению, знать номенклатуру современных микросистемных устройств, быть способным провести расчет и оценку основных характеристик микросистемных устройств	2.6.2
СК-18	Владеть основными конструкциями компонентов изделий микросистемной техники и методами их расчета, быть способным применять математические и физические модели для описания и анализа процессов, протекающих в микромеханических компонентах при внешних воздействиях	2.7.1
СК-19	Владеть информацией об основных элементах микро- и нанозлектромеханических систем, знать основные принципы их построения и функционирования, применять полученные знания для разработки компонентов микро- и нанозлектромеханических систем с учетом требований к их конструкции, технологии их создания и эксплуатации	2.7.2
СК-20	Обладать базовыми навыками оценки патентоспособности и патентной чистоты технических решений	2.4.2

Разработан в качестве примера реализации образовательного стандарта по специальности 6-05-0716-08 "Микро- и наносистемная техника"

¹ Дифференцированный зачет

СОГЛАСОВАНО

Председатель УМО по образованию
в области приборостроения

А.М.Маляревич

Председатель НМС по специальности
1-38 01 04 Микро- и наносистемная техника

С.А. Чижик

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
профессионального образования
Министерства образования Республики Беларусь

Проректор по научно-методической работе
Государственного учреждения образования
"Республиканский институт высшей школы"

Рекомендован к утверждению Президиумом Совета УМО
по образованию в области приборостроения
Протокол № _____ от _____

Эксперт-нормоконтролер

